



参加無料

『表面粗さ測定技術セミナー』

開催日時： 令和6年2月27日（火） 13：30～16：00

1部 13：30～14：30

2部 14：45～15：45 質疑応答15分

開催場所： 山梨県産業技術センター イノベーション支援棟

イノベーションルーム2（甲府市大津町2094）

講演形式： 現地聴講

定員： 各部20名

講演内容：（希望する講演の個別選択可能です）

1部：「表面粗さの基礎－高精度粗さ・形状測定について－」

アメテック(株)テーラーホブソン事業部

アプリケーションエンジニア 西川 洋太 氏

テーラーホブソン社は英国にて1886年創立して世界に先駆けて超精密表面粗さ/真円度測定機を開発したパイオニア企業です。本講演では表面粗さの基本から測定原理、形状測定について、世界最先端の最新測定機およびアプリケーション事例をご紹介します。

2部：「非接触表面性状測定と三次元表面粗さの規格」

アメテック(株)ザイゴ事業部

アプリケーションエンジニア 野中 悠太郎 氏

ZYGO社は米国コネチカット州にて1970年創立された企業です。製造する光学式非接触三次元表面性状測定機NewViewシリーズは、白色干渉の原理を用いた測定手法で、どんな表面も短時間で超高精度測定が可能です。本講演では測定原理、三次元表面粗さの規格および最近の測定ニーズや測定事例をご紹介します。

申込書は裏面にあります



申 込 書

会社名	
部署	
役職・氏名	
電話番号	
連絡先 E-mail	
参加希望枠	希望される項目にチェックをお願いします <input type="checkbox"/> 1 部 <input type="checkbox"/> 2 部

令和6年2月26日(月)までに、EメールもしくはFAXにてお申し込み下さい

申込・お問い合わせ先：機械技術部 石黒・坂本

E-Mail：yitc-kit04@pref.yamanashi.lg.jp

(エルジー)

TEL：055-243-6111 (代表) FAX：055-243-6146 (機械技術部直通)